

國立交通大學

光電工程學系 光電研究所碩士班

碩士論文

低溫多晶矽薄膜電晶體變動性
之可靠度的研究



**Study of Reliability Variation for Low
Temperature Polysilicon Thin Film Transistors**

研究生：余承和

指導教授：戴亞翔教授

中華民國九十四年六月

低溫多晶矽薄膜電晶體變動性
之可靠度研究

**Study of Reliability Variation for Low
Temperature Polysilicon Thin Film Transistors**

研究生：余承和

Student : Cheng-Ho Yu

指導教授：戴亞翔教授

Advisor : Ya-Hsiang Tai

國立交通大學
光電工程學系 光電研究所碩士班
 碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Electro-Optical Engineering
College of Electrical Engineering and Computer Science
National Chiao Tung University

In partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Science

In

Electro-Optical Engineering

June 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十四年六月